

パワートランジスタ用ソケット、ZIFタイプ (For T0-220, T0-3P, T0-254, etc) Power Transistor Test Sockets, ZIF type

30A
非RoHS

- パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストに御使用頂けます。
For a Test of Power Transistors, Thyristors and other discrete devices.

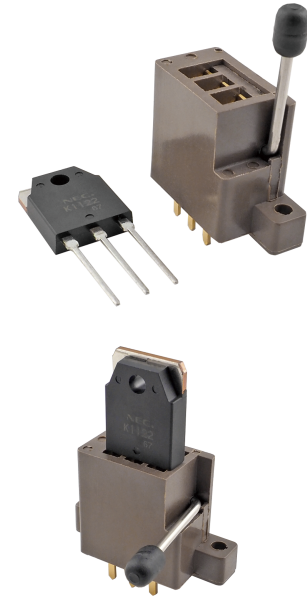
仕様 Specifications

挿抜耐久性 Mating Durability : 1,000 cycles (note*)
 接触抵抗 Contact Resistance : 20 mΩ max
 定格電流 Rating Current : DC30 A at 25°C
 絶縁抵抗 Insulation Resistance : 500 MΩ min
 耐電圧 Withstanding Voltage : DC1500V 1min, AC2000Vrms 1min at 25°C
 使用温度範囲 Temperature Range : -55°C~+150°C

note* : 弊社製作の試験用リードピンによる。Using a Standard Test Lead of ours

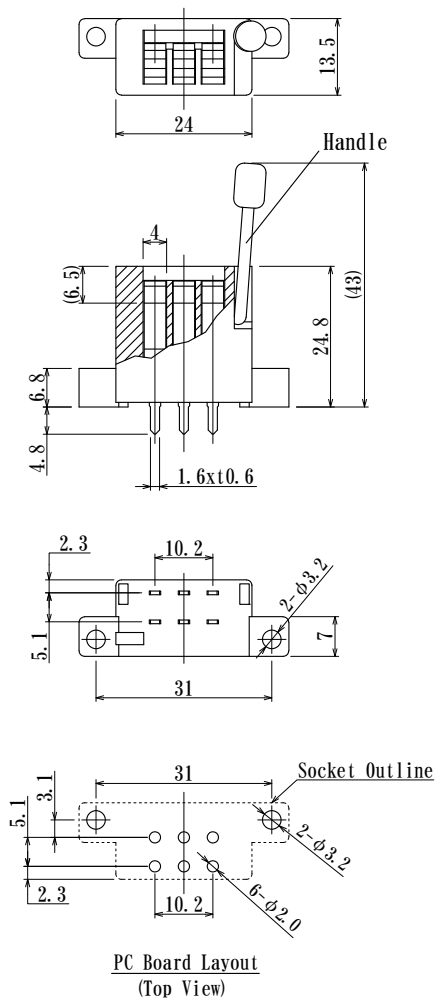
材質 Materials

ボディ Body : High Temp. Thermoplastic
 コンタクト Contact : 銅合金 ニッケル下地金メッキ Copper Alloy, Au plating over Ni

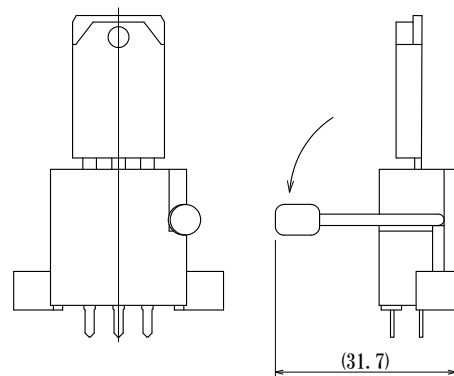


How to order

T3P-H248-ZIF



ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
 The ZIF structure is designed to conduct by tipping the handle forward.



Device Set

T-Rise Current Chart (Reference)

